

Unión Particular para la Clasificación Internacional de Patentes (Unión de la IPC) Comité de Expertos

**Quincuagésima tercera sesión
Ginebra, 24 y 25 de febrero de 2022**

INFORME

aprobado por el Comité de Expertos

INTRODUCCIÓN

1. El Comité de Expertos de la Unión de la CIP (en adelante, “Comité”) celebró su quincuagésima tercera sesión en Ginebra, en formato híbrido, los días 24 y 25 de febrero de 2022. Estuvieron representados en la sesión los siguientes miembros del Comité: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Canadá, China, Croacia, Dinamarca, España, Estados Unidos de América, Estonia, Federación de Rusia, Francia, Grecia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, México, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, República Checa, República de Corea, República de Moldova, Rumanía, Suecia, Suiza, Turkmenistán, Turquía, Ucrania y Uzbekistán (37). También estuvieron representadas la Organización Eurasiática de Patentes (EAPO), la Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Asociación Europea de Estudiantes de Derecho (ELSA International). La lista de participantes figura en el Anexo I del presente informe.

2. La sesión fue inaugurada por el Sr. Kunihiro Fushimi, director de la División de Clasificaciones Internacionales y Normas Técnicas, Sector de Infraestructura y Plataformas, quien dio la bienvenida a los participantes.

ELECCIÓN DE LA MESA

3. El Comité eligió por unanimidad a la Sra. Catia Valdman (Brasil) como presidenta y a la Sra. Magalie Mathon (Francia) y al Sr. Yoshitaka Ota (Japón) como vicepresidentes.
4. La Sra. Xu Ning (OMPI) desempeñó la función de secretaria de la sesión.

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

5. El Comité aprobó por unanimidad el orden del día, que figura en el Anexo II del presente informe.
6. Tal como lo decidieran los órganos rectores de la OMPI en su décima serie de reuniones, celebrada del 24 de septiembre al 2 de octubre de 1979 (véase el documento AB/X/32, párrafos 51 y 52), el informe de la presente sesión refleja únicamente las conclusiones del Comité (decisiones, recomendaciones, opiniones, etc.) y no refleja, en particular, las declaraciones hechas por cada participante, excepto en los casos en que se haya formulado o repetido una reserva en relación con alguna conclusión específica del Comité una vez alcanzada esa conclusión.

INFORME SOBRE LA MARCHA DEL PROGRAMA DE REVISIÓN DE LA CIP; FORMATO DE LAS FUTURAS REUNIONES DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA REVISIÓN DE LA CIP

7. El Comité tomó nota de un informe de situación sobre las actividades del Grupo de Trabajo sobre la Revisión de la CIP (Grupo de Trabajo), en particular, sobre el programa de revisión de la CIP, que figura en el anexo 18 del expediente de proyecto CE 462, preparado por la Oficina Internacional.
8. El Comité observó que el número medio de nuevas entradas por año, que entraron en vigor en las versiones recientes de la CIP, casi se duplicó en comparación con las versiones de la CIP publicadas hace cinco o diez años, siendo el mayor número de nuevas entradas en la versión CIP-2022.01.
9. El Comité también observó que el número de proyectos de revisión por año se mantuvo en el mismo nivel de los últimos años. Además de las Oficinas de la Cooperación Pentilateral, otras oficinas como las del Brasil, el Canadá, Alemania y el Reino Unido presentaron peticiones de revisión en el marco de la hoja de ruta renovada para la revisión de la CIP (hoja de ruta). El número y la situación de todos los proyectos que se llevan a cabo en el marco de la hoja de ruta se incluyeron en el informe de situación.
10. El Comité expresó su gran satisfacción por la labor realizada por el Grupo de Trabajo, en particular durante los últimos años de la pandemia de COVID-19.
11. Se recordó que, en su quincuagésima segunda sesión, el Comité invitó a la Oficina Internacional a estudiar la viabilidad de congelar el foro electrónico de la CIP para que el Comité lo examinara en su próxima sesión (véase el documento IPC/CE/52/2, párrafos 18 y 19).
12. El Comité aceptó la recomendación de la Oficina Internacional de no congelar el foro electrónico antes de cada reunión del Grupo de Trabajo. La Oficina Internacional seguirá aplicando las medidas adoptadas por el Comité (véase el documento IPC/CE/52/2, a) a c) del párrafo 19), para evitar que se presenten propuestas tardías en el foro electrónico justo antes de las reuniones del Grupo de Trabajo.
13. El Comité también debatió una propuesta conjunta presentada por la OEP y los Estados Unidos de América en el anexo 6 del expediente de proyecto CE 539, relativa a la mejora y el

equilibrio de las reuniones anuales de primavera y otoño del Grupo de Trabajo, con respecto a la finalización del número de proyectos.

14. El Comité observó que una finalización bien equilibrada del número de proyectos, en particular de los “grandes” proyectos de revisión, entre las dos reuniones anuales del Grupo de Trabajo ayudaría a aplicar a tiempo la nueva versión de la CIP en la Clasificación Cooperativa de Patentes (CPC).

15. Habida cuenta de que una entrada en vigor a tiempo del nuevo sistema de la CIP es de suma importancia para la comunidad de usuarios de la CIP, y de que una integración a tiempo del nuevo sistema de la CIP en la CPC también beneficiaría a los usuarios de la CIP, el Comité tomó buena nota de esta propuesta y acordó dar instrucciones al Grupo de Trabajo para que considere una forma de trabajo mejorada y equilibrada entre sus reuniones anuales con respecto a la finalización del número de proyectos. Se prestará especial atención a los proyectos “grandes” (por ejemplo, con más de 100 nuevas subdivisiones), por ejemplo, según las particularidades del caso y con la coordinación entre los relatores, la Oficina Internacional, la OEP y los Estados Unidos de América.

16. El Comité hizo hincapié en que ese equilibrio no debe impedir que el Grupo de Trabajo examine, debata y concluya esos “grandes” proyectos en cualquier reunión, siempre que estén listos para su conclusión.

17. El Comité también debatió las posibles opciones de formato para las futuras reuniones del Grupo de Trabajo basándose en la experiencia adquirida durante el periodo pandémico. Destacó la importancia de la participación física para debatir las cuestiones complejas, intercambiar puntos de vista de forma eficaz y mantener debates informales durante la pausa, al tiempo que apoyó la posibilidad continua de fomentar la participación a distancia. También subrayó la importancia de intensificar el uso del foro electrónico de la CIP junto con el formato híbrido.

INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS PROGRAMAS DE REVISIÓN DE LA CPC Y EL FI

18. Los Estados Unidos de América y la OEP presentaron una ponencia conjunta sobre las últimas novedades relativas a la CPC. El Japón presentó un informe sobre el avance en relación con el sistema FI/F-Term.

19. El Comité tomó nota de que la frecuencia de las publicaciones de la CPC seguiría siendo de cuatro veces al año para 2022 y 2023, es decir, el 1 de enero, el 1 de febrero, el 1 de mayo y el 1 de agosto. El Comité también tomó nota de que, en la actualidad, casi sesenta y cinco millones de documentos de patentes están clasificados en la CPC. Además, se informó al Comité sobre la disponibilidad de la información de la CPC en las publicaciones EP-A y EP-B y el servicio de reclasificación de la CPC. El Comité expresó su agradecimiento a la OEP por su posible contribución para facilitar la reclasificación de la CIP mediante el uso de los datos de reclasificación de la CPC.

20. El Comité tomó nota de que, a partir de 2023, la revisión del FI para la correspondencia con la nueva versión de la CIP y la publicación de la nueva versión de la CIP se realizarán una vez al año al mismo tiempo, es decir, en enero. El Comité también observó que la alineación del FI con la última versión de la CIP había alcanzado el 99,74% en abril de 2021, y el Comité expresó su gratitud al Japón por sus esfuerzos para mejorar la alineación entre el FI y la última CIP.

21. El Comité reconfirmó el entendimiento compartido de que la coherencia entre la CIP y otras clasificaciones es importante y que debían continuar los esfuerzos para mejorar y mantener dicha coherencia.

INFORME DEL GRUPO DE ESPECIALISTAS EN TECNOLOGÍAS DE SEMICONDUCTORES (EGST)

22. El debate se basó en el informe de un relator de la OEP en nombre del EGST que figura en el anexo 325 del expediente del proyecto CE 481 y en el anexo 3 del expediente del proyecto CE 539.
23. El Comité tomó nota de que el EGST ha diseñado hasta el momento siete subclases de la nueva clase H10, que se exponen en el anexo 320 del proyecto CE 481 y están destinadas a asumir la totalidad de la subclase H01L existente.
24. Se informó al Comité de que está previsto que el EGST cree unos ocho o nueve proyectos C a través del proyecto CE 481 y que la puesta en marcha de los proyectos C se hará de forma escalonada. También se informó de que el primer lote de cuatro proyectos C, a saber, C 510, C 511, C 512 y C 513, se puso en marcha en el foro electrónico de la CIP a finales de 2021. Se ha elaborado una hoja de ruta (véase el apéndice del anexo 3 del proyecto CE 539) que el EGST actualizará periódicamente para completar el proyecto CE 481.
25. El Comité hizo extensivo su agradecimiento a la OEP, la Oficina principal del EGST, y a todas las Oficinas integrantes del EGST por el enorme trabajo y su contribución a los resultados obtenidos hasta el momento, en particular, en los últimos años durante la pandemia de COVID-19.
26. El Comité decidió aprobar la última hoja de ruta y la continuación del proyecto CE 481 y las actividades del EGST.

USO DE MARCAS EN LA CIP

27. El debate se basó en una propuesta de la OEP que figura en el anexo 4 y en los comentarios de los anexos 7 y 9 del expediente de proyecto CE 539, así como en el anexo 2 del expediente de proyecto M 815.
28. El Comité acordó que, en la medida de lo posible, debería evitarse el uso de marcas en la CIP, y decidió modificar el actual párrafo 29 de las Directrices para la revisión de la CIP (en adelante, Directrices), como sigue:

“29. Se desaconseja firmemente el uso de marcas (comerciales, registradas, de servicio, etc.). Si el uso de una marca es absolutamente indispensable, la marca debe presentarse solo en ejemplos y acompañada del símbolo correspondiente (™, ®, SM, etc.).”

29. Se invitó a la Oficina Internacional a realizar un examen de los términos o expresiones existentes que hacen referencia a las marcas en la CIP, en el marco del proyecto M 815, para que el Grupo de Trabajo los estudie, indicando si deben eliminarse del esquema y de las definiciones a la vista del nuevo párrafo 29 de las Directrices.

ENMIENDAS A LA GUÍA DE LA CIP Y OTROS DOCUMENTOS BÁSICOS DE LA CIP

30. El debate se basó en el expediente del proyecto CE 454, en particular en los anexos 57, 58 y 61, presentados respectivamente por la OEP, la Oficina Internacional y el Brasil, que contienen propuestas de modificación de la Guía de la CIP (en adelante, Guía) e integran los comentarios de las oficinas.
31. El Comité aprobó, con algunos cambios, las modificaciones del encabezamiento de la primera página y de los párrafos 13, 39, 41, 51, 60, 63, 69, 72, 82, 85, 87 a 88, 91, 94, 105, 114, 147, 150, 154, 164, 174, 183 a 185 y 187 de la Guía, que figuran en los anexos 65 y 66 del expediente del proyecto. Esas modificaciones se incluirían en la versión 2022 de la Guía.

32. En cuanto a la propuesta de la OEP que figura en el anexo 57 de introducir uno o varios párrafos adicionales en la Guía para el esquema secundario, el Comité acordó crear el proyecto CE 531, con la OEP como relatora, para su ulterior estudio.
33. El Comité también acordó que el debate sobre el uso del término “ámbito residual” en la Guía debería continuar en el marco del proyecto CE 454, e invitó a que se formularan comentarios y propuestas adicionales para que el Comité los examine en su próxima sesión.
34. El debate también se basó en el anexo 79 del expediente del proyecto CE 455, en el que se recopilan todas las propuestas de modificación de las Directrices presentadas, respectivamente, por la OEP, la Oficina Internacional y el Reino Unido en los anexos 75 a 77 del expediente del proyecto, junto con los comentarios de las oficinas.
35. El Comité aprobó las modificaciones propuestas al párrafo 29 de las Directrices en relación con el punto del orden del día “Uso de marcas en la CIP” (párrafo 28).
36. El Comité aprobó, con algunas variaciones, las modificaciones de los párrafos 1, 5, 11, 12, 13, 16, 17, 17bis (nuevo), 17ter (nuevo), 20bis, 21, 23, 29, 30, 30bis, 30ter (nuevo), 31, 32, 33bis (nuevo), 34, 37, 40, 41, 41ter, 42 a 45, 49, 52, 52bis (nuevo) 52ter (nuevo), 53, 58, 61, 61bis (nuevo), 62, 63, 64, 67, 71, 74, 75, 77, 77bis (nuevo), 78, 79, 79bis (nuevo), 81bis (nuevo), 86bis (nuevo), 88, 94 (suprimido), 96, 96bis (nuevo), 96ter (nuevo), 98, 101, 107bis (nuevo), 113, 114, 118, 120, 123, 124, 126, 126bis, 129, 130, 134 (nuevo), 135 (nuevo), 136 (nuevo), 137 (nuevo), 138 (nuevo) y 139 (nuevo) de las Directrices, las modificaciones de los párrafos 2 a 4 y 7 del Apéndice I, los párrafos 1 a 4, 6 y 7 del Apéndice II, los párrafos 6, 8 y 9 del Apéndice III, los párrafos 2bis (nuevo), 3, 6, 7 y 8bis (nuevo) del Apéndice IV, la petición de revisión de la CIP del Apéndice V y las Directrices para la redacción de las definiciones de la Clasificación del Apéndice VI de las Directrices, que figuran en los Anexos 82 y 83 del expediente del proyecto.
37. Respecto al uso de abreviaturas en la CIP en singular, el Comité acordó crear un nuevo proyecto de mantenimiento, el M 821, con Suecia como relatora, para seguir estudiando su uso adecuado en toda la CIP.
38. El Comité tomó nota de que las propuestas de la OEP y del Reino Unido contienen sugerencias para mejorar la plantilla de definiciones. El Comité tomó nota de esas sugerencias y acordó que la plantilla de definiciones debería seguir siendo lo más sencilla y clara posible y que deberían evitarse los cambios periódicos, salvo que sean inevitables.

PANORAMA GENERAL DE LA SOLUCIÓN DE GESTIÓN DE LISTAS DE TRABAJO DE LA CIP (IPCWLMS) Y CUESTIONES CONEXAS

39. El debate se basó en un resumen de las cuestiones relacionadas con la IPCWLMS realizado por la Oficina Internacional que figura en el anexo 22 y en los comentarios del anexo 23 del expediente del proyecto CE 492.
40. El Comité tomó nota de que la OEP preparará un servicio para las oficinas que utilizan la CPC, el cual permitirá reutilizar la reclasificación de los símbolos de la CPC en la CIP mediante la concordancia CPC-CIP.
41. Se acordó que el Equipo Técnico dedicado a aspectos específicos en relación con los requisitos operativos de la IPCWLMS, creado por el Comité en su cuadragésima novena sesión (véase el documento IPC/CE/49/2), seguirá ocupándose de las cuestiones relacionadas con el algoritmo de distribución, el ciclo de vida de la reclasificación y la reclasificación de las familias con códigos de país antiguos, por ejemplo, DD, SU o CS, planteadas por la Oficina Internacional en los puntos 1, 2 y 5 del anexo 22. Se invitó al Equipo Técnico a preparar una propuesta para el proyecto CE 492 a fin de que el Comité la examine en su próxima sesión. Se

invitó a la Oficina Internacional a estudiar la posibilidad de celebrar reuniones en línea del Equipo Técnico cuando fuera necesario.

42. Se acordó además realizar una encuesta sobre la situación actual en las oficinas acerca del uso que hacen de la CIP en cuanto a los niveles de clasificación. El resultado de la encuesta se utilizará para actualizar esta información en el algoritmo de distribución. Se invitó a la Oficina Internacional a preparar la encuesta, que deberá ir seguida de un informe dirigido al Comité en su próxima sesión.

43. El Comité tomó nota de la repercusión del atributo DIYO (elaboración propia) en el algoritmo de distribución e invitó a todas las oficinas a considerar su participación como DIYO en la reclasificación de las familias de patentes a fin de reflejar mejor el origen de las familias distribuidas y agilizar el procesamiento de los datos de clasificación, lo que podría reducir el tiempo necesario para crear listas de trabajo para cada fase de reclasificación.

44. El Comité también tomó nota de la información sobre la desactivación automática de los símbolos antiguos en el material antiguo, las estadísticas de reclasificación y las advertencias, la validación durante el proceso de reclasificación y otras cuestiones presentadas en el anexo 22. El Comité acordó que la cuestión relacionada con la validación durante el proceso de reclasificación que figura en el punto 9 del anexo 22 y las cuestiones conexas serán tratadas por el Equipo Técnico de acuerdo con el párrafo 41.

RECLASIFICACIÓN DE LA CIP BASADA EN LA IA: POSIBLE SUSTITUCIÓN DE LA “TRANSFERENCIA POR DEFECTO”

45. El debate se basó en el anexo 5 del expediente del proyecto CE 539, relativo a un documento elaborado por la Oficina Internacional sobre la reclasificación de la CIP basada en la IA.

46. El Comité tomó nota de que la Oficina Internacional ha emprendido el desarrollo de un servicio de reclasificación basado en la IA que tiene por objeto las familias de patentes que quedan por reclasificar en la fase 3 de la IPCWLMS, como alternativa a la actual “transferencia por defecto”. Se informó de que el servicio utiliza la tecnología de IPCCAT y se nutre de los datos de DocDB.

47. El Comité también tomó nota de que el servicio será probado por la Oficina Internacional y decidió crear el proyecto CE 532 para recopilar los resultados de las pruebas, la documentación pertinente de ese servicio de reclasificación de la CIP basado en la IA y los comentarios que presenten las oficinas sobre su satisfacción acerca de los resultados. El Comité decidirá más adelante si el servicio puede ser considerado para sustituir en el futuro a la “transferencia por defecto”.

INFORME SOBRE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS RELACIONADOS CON LA CIP

48. La Oficina Internacional presentó un resumen de los avances en los sistemas informáticos relacionados con la CIP y, en particular, sobre los cambios técnicos en relación con WIPO Delta, IPCPUB/IPCCAT y el aspecto común de la OMPI.

49. El Comité tomó nota de que los conjuntos de datos para la categorización automática de textos dejaron de estar disponibles en 2021. No obstante, todavía es posible que las oficinas envíen una solicitud a la Oficina Internacional para que se genere el conjunto de datos WIPO Delta.

50. El Comité tomó nota de la situación del actual conjunto de datos CIP/CPC/FI publicado en IPCPUB. En cuanto a los desajustes entre la CPC y la CIP, los Estados Unidos de América aceptaron ponerse en contacto con la Oficina Internacional para buscar una solución. También

se informó al Comité sobre la nueva infraestructura de la plataforma de publicación de la CIP, IPCPUB 9.

51. Se informó de que el proyecto CE 522, relativo a las “Divergencias en la asignación de los símbolos de la CIP”, seguirá abierto a posibles comentarios hasta la próxima sesión del Comité.

EXPERIENCIAS DE LAS OFICINAS EN LA CLASIFICACIÓN ASISTIDA POR MÁQUINA (POR EJEMPLO, BASADA EN LA IA)

52. El Comité tomó nota de las presentaciones sobre la experiencia con la clasificación automatizada (por ejemplo, basada en la IA) realizada por las siguientes oficinas: Brasil, la OEP, Japón y los Estados Unidos de América.

53. El Comité observó que, para la mayoría de las Oficinas que hicieron presentaciones, el uso actual de la IA ha pasado de la función de remitir las solicitudes de patentes a las divisiones de examen pertinentes a la de facilitar la búsqueda del estado de la técnica por parte de los examinadores a fin de contribuir realmente a la clasificación y reclasificación.

54. El Comité reconoció la importancia del intercambio de información en este campo e invitó a más oficinas a compartir su experiencia con el desarrollo de herramientas internas de clasificación automatizada en su próxima sesión. Se informó de que todos los materiales de presentación, incluidos los antiguos, están disponibles en el foro electrónico de la CIP bajo el proyecto CE 524.

MARCO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS PARA LA CLASIFICACIÓN DE PATENTES

55. El debate se basó en el expediente del proyecto CE 523.

56. La Oficina Internacional presentó una propuesta para la revisión de las competencias de los examinadores de patentes relacionadas con la CIP, que forman parte de un marco más amplio de competencias para el examen de fondo de las patentes (véanse los anexos 2 y 3 del proyecto CE 523), la cual incluía explicaciones e instrucciones para la revisión, así como una estimación de la carga de trabajo. La Oficina Internacional explicó además que estaba previsto que dos rondas de comentarios fueran suficientes para preparar un cuadro unificado de dichas competencias a fin de que el Comité lo finalice en su próxima sesión.

57. Se acordó revisar las competencias relacionadas con la CIP de ese marco y se invitó a la Oficina Internacional, como relatora, a fijar un plazo para la primera ronda de comentarios.

58. La Oficina Internacional se ofreció a organizar un breve webinar, previa solicitud, si los especialistas que participen en la revisión lo consideran útil para obtener más explicaciones sobre los principios que rigen el diseño del marco.

59. El Comité de Expertos aprobó por unanimidad el presente informe por medios electrónicos el 17 de marzo de 2022.

[Siguen los Anexos]

LISTE DES PARTICIPANTS/
LIST OF PARTICIPANTS

I. ÉTATS MEMBRES/MEMBER STATES

ALLEMAGNE/GERMANY

Alessandra SANI (Ms.), Senior Adviser, Classification Systems Section, German Patent and Trade Mark Office (DPMA), Munich

Oliver STEINKELLNER (Mr.), Head, Classification Systems Section, German Patent and Trade Mark Office (DPMA), Munich

ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA

Abdullah ALGHAMDI (Mr.), Patents Expert, Patents Department, Saudi Authority for Intellectual Property (SAIP), Riyadh

Rawabi ALMUHIMED (Ms.), Patents Department, Saudi Authority for Intellectual Property (SAIP), Riyadh

ARGENTINE/ARGENTINA

Silvia CAMPILLAY (Ms.), Division Head, Industrial Processes Area - Polymers, Foodstuffs and Textile, National Patent Administration (ANP) - Substantive Examination Department, National Institute of Industrial Property (INPI), Buenos Aires

Viviana SALICE (Ms.), Head, Pharmaceuticals Division, National Patent Administration (ANP), Chemical Substantive Examination Department, National Institute of Industrial Property (INPI), Buenos Aires

Juan Pablo OTONELLO (Sr.), Examinador de Búsquedas, Información Tecnológica, Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), Buenos Aires

ARMÉNIE/ARMENIA

Avetis PERYAN (Mr.), Head, Inventions and Industrial Designs Examination Department, Intellectual Property Office of the Ministry of Economy, Yerevan

Gayane VOPYAN (Ms.), Chief Specialist, Inventions and Industrial Designs Examination Department, IP Office of the Ministry of Economy of the Republic of Armenia, Yerevan

AUSTRALIE/AUSTRALIA

Lloyd JAMES (Mr.), Examiner, Patents Examination Group, IP Australia, Canberra

Deb MCDONNELL (Ms.), Examiner, Patent Examination Group, IP Australia, Elsternwick

Alex SIMMONS (Mr.), Patent Examiner, Patent Examination Group, IP Australia, Canberra

Mu-En TIEN (Mr.), Patent Examiner, Patent Examination Group, IP Australia, Canberra

AUTRICHE/AUSTRIA

Akos BAZSO (Mr.), Classification Representative, Austrian Patent Office, Federal Ministry for Climate Protection, Vienna

BOSNIE-HERZÉGOVINE/BOSNIA AND HERZEGOVINA

Ana SPIRIC (Ms.), Patent Examiner, Patent Department, Institute for Intellectual Property, Ministry of Foreign Affairs of Bosnia and Herzegovina, Banja Luka

BRÉSIL/BRAZIL

Catia VALDMAN (Ms.), Head of Telecommunications Division, Head of the Classification Group, Special Secretariat for Productivity, Employment and Competitiveness, Ministry of Economy, National Institute of Industrial Property (INPI), Rio de Janeiro

Maria Raquel CATALANO DE SOUSA (Ms.), Classification Group, Special Secretariat for Productivity, Employment and Competitiveness, Ministry of Economy, National Institute of Industrial Property (INPI), Rio de Janeiro

Rodrigo FERRARO (Mr.), Patent Examiner, Special Secretariat for Productivity, Employment and Competitiveness, Ministry of Economy, National Institute of Industrial Property (INPI), Belo Horizonte

Darcio GOMES PEREIRA (Mr.), Special Secretariat for Productivity, Employment and Competitiveness, Ministry of Economy, National Institute of Industrial Property (INPI), Campinas

Rafael NUNES (Mr.), Analyst, IT, Special Secretariat for Productivity, Employment and Competitiveness, Ministry of Economy, National Institute of Industrial Property (INPI), Rio de Janeiro

Tatielli BARBOSA (Ms.), Patent Examiner, Inorganic Chemistry Division and Classification Group, Special Secretariat for Productivity, Employment and Competitiveness, Ministry of Economy, National Institute of Industrial Property (INPI), Rio de Janeiro

BULGARIE/BULGARIA

Radoslava MLADENOVA (Ms.), Patent Examiner, Directorate "Examination and Protection of Inventions, Utility Models and Industrial Designs", Patent Office of the Republic of Bulgaria, Sofia

Aneta KOLEVA (Ms.), Patent Examiner, Directorate "Examination and Protection of Inventions, Utility Models and Industrial Designs", Patent Office of the Republic of Bulgaria, Sofia

CANADA

Nancy BEAUCHEMIN (Mme), Gestionnaire de programme - International, Direction des brevets - OPIC, Innovation, Sciences et Développement Économique Canada ISDE, Gatineau

CHINE/CHINA

LI Xiao (Ms.), Senior Program Administrator, Patent Documentation Department, Patent Office, China National Intellectual Property Administration (CNIPA), Beijing

LI Rong (Ms.), Deputy Research Director, Patent Research and Development Department, China Patent Technology Development Corporation, China National Intellectual Property Administration (CNIPA), Beijing

WANG Wenjing (Ms.), Director, Patent Classification and Data Process Department III, China Patent Technology Development Corporation, China National Intellectual Property Administration (CNIPA), Beijing

CROATIE/CROATIA

Gordana RICIJAŠ (Ms.), Head, Patent Department, State Intellectual Property Office of the Republic of Croatia (SIPO), Zagreb

Jelena ZAFRAN (Ms.), Head, Technical Experts Service, Patent Department, State Intellectual Property Office of the Republic of Croatia (SIPO), Zagreb

DANEMARK/DENMARK

Sven NYTOFT RASMUSSEN (Mr.), Senior Examiner, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of Industry, Business and Financial Affairs, Taastrup

ESPAGNE/SPAIN

Elena PINA (Sra.), Técnica Superior Examinadora de Patentes, División de física y de patentes eléctricas, Oficina Española de Patentes y Marcas, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (OEPM), Madrid

ESTONIE/ESTONIA

Tiina LILLEPOOL, Principal Examiner, Patent Department, The Estonian Patent Office, Tallinn

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA

Derris H. BANKS (Mr.), Chief Patent Classification Official, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria

Christopher KIM (Mr.), Director, Classification Quality and International Coordination, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria

Richard LEE (Mr.), International Patent Classifier, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria

Dimple SOPARIWALA (Ms.), International Patent Classifier, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria

Nelson YANG (Mr. Senior Advisor, International Patent Business Solutions, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION

Zoya VOYTSEKHOVSKAYA (Ms.), Senior Researcher, Federal Institute of Industrial Property (ROSPATENT), Moscow

Fedor SARATOVSKII (Mr.), Researcher, Federal Institute of Industrial Property (ROSPATENT), Moscow

Olga TIKHOMIROVA (Ms.), Researcher, Federal Institute of Industrial Property (ROSPATENT), Moscow

Vladislav MAMONTOV (Mr.), Head, Multilateral Cooperation Division, International Cooperation Department, Federal Institute of Industrial Property (ROSPATENT), Moscow

FRANCE

Magalie MATHON (Mme), chargée de mission CIB, Département des Brevets, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie

GRÈCE/GREECE

Evangelos GIANNAKOPOULOS (Mr.), Senior Examiner, Head of Mechanical Engineering Department, Industrial Property Organization of Greece, Athens

IRLANDE/IRELAND

Fergal BRADY (Mr.), Examiner of Patents, Patent Examination, Intellectual Property Office of Ireland, Kilkenny

ISRAËL/ISRAEL

Orit REGEV (Ms.), Deputy Superintendent of Examiners, Israel Patent Office, Ministry of Justice, Jerusalem

ITALIE/ITALY

Lino FANELLA (Mr.), Patent Examiner, Patent Department, Directorate General for the Protection of Industrial Property, Patent and Trademark Office (UIBM), Ministry of Economic Development, Rome

JAPON/JAPAN

Yoshitaka OTA (Mr.), Director, Examination Policy Planning Office, Japan Patent Office (JPO), Ministry of Economy, Trade and Industry, Tokyo

Sumio MIGITA (Mr.), Deputy Director, Examination Policy Planning Office, Japan Patent Office (JPO), Ministry of Economy, Trade and Industry, Tokyo

Ayano NISHITA (Ms.), Assistant Director, Examination Policy Planning Office, Japan Patent Office (JPO), Ministry of Economy, Trade and Industry, Tokyo

Yuto NISHIZUKA (Mr.), Assistant Director, Examination Policy Planning Office, Japan Patent Office (JPO), Ministry of Economy, Trade and Industry, Tokyo

MEXIQUE/MEXICO

Gonzalo CASTRO RODRIGUEZ (Sr.), Especialista en Propiedad Industrial, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), México

Miguel GONZALEZ AGUILAR (Sr.), Especialista en Propiedad Industrial, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), México

Ayari FERNANDEZ SANTA CRUZ RUIZ (Sra.), Especialista en Propiedad Industrial, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), México

Pablo ZENTENO MARQUEZ (Sr.), Especialista en Propiedad Industrial, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), México

Maria Del Pilar ESCOBAR BAUTISTA (Sra.), Consejero, Propiedad Intelectual, Misión Permanente, Ginebra

NORVÈGE/NORWAY

Bjørn TISTHAMMER (Mr.), Head of Section, Patent Department, Norwegian Industrial Property Office (NIPO), Frogner

Bente AARUM-ULVÅS (Ms.), Chief Examiner, Patent Department, Norwegian Industrial Property Office (NIPO), Oslo

OUZBÉKISTAN/UZBEKISTAN

Ikram ABDUKADIROV (Mr.), Head, Invention and Utility Model Department, Intellectual Property Agency under the Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan, Tashkent

Karel-Ieronim MAVLYANOV (Mr.), Group of Industrial Technologies and Construction, Department of Inventions and Utility Models, Intellectual Property Agency under the Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan, Tashkent

PAYS-BAS/NETHERLANDS

Robert SCHOUWENAARS (Mr.), Technical Advisor, Netherlands Patent Office, Ministry of Economic Affairs, The Hague

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA

LEE WangSeok (Mr.), Head of Group, Patent Information Promotion Center (PIPC), Daejeon

JUNG ByungTe (Mr.), Head of Team, Classification Team, Patent Information Promotion Center (PIPC), Daejeon

JANG WooYoung (Mr.), Associate Staff, Electronics/Classification Department, Daejeon

PARK SungChul (Mr.), Deputy Director, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA

Natalia CAISIM (Ms.), Head, Examination Division, Patents, State Agency on Intellectual Property (AGEPI), Chisinau

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC

Jarmila AVRATOVA (Ms.), Engineer, Patent Information, Industrial Property Office of the Czech Republic, Prague

ROUMANIE/ROMANIA

Adrian NEGOITA (Mr.), Head of Mechanics, Patent Department, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM

Jeremy COWEN (Mr.), Senior Patent Examiner - Classification, Patent Examining Division, UK Intellectual Property Office (UKIPO), Newport

Peter MASON (Mr.), Deputy Director, Patent Examining Division, UK Intellectual Property Office (UKIPO), Newport

SUÈDE/SWEDEN

Anders BRUUN (Mr.), Patent Expert, Patent Division, Swedish Patent and Registration Office (PRV), Stockholm

Tomas LUND (Mr.), Delegate, Patent Division, Swedish Patent and Registration Office (PRV), Stockholm

Moa EMLING (Ms.), Senior Patent Examiner, Chemistry - Patent Department, Swedish Patent and Registration Office (PRV), Stockholm

SUISSE/SWITZERLAND

Pascal WEIBEL (M.), chef Examen, Division des brevets, Institut fédéral de la propriété intellectuelle, Berne

TURKMÉNISTAN/TURKMENISTAN

Amanmyrat DZHORAYEV (Mr.), Head, Invention Division, Examination Department, State Service for Intellectual Property, Ministry of Finance and Economy, Ashgabat

TURQUIE/TURKEY

Bahar DOGAN (Ms.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission of Turkey to the WTO, Geneva

UKRAINE

Sergii TORIANIK (Mr.), Director, Department for Examination of Applications for Inventions, Utility Models and Layout Designs, Ministry of Economy of Ukraine, State Enterprise "Ukrainian Intellectual Property Institute" (Ukrpatent), Kyiv

Yevheniia BELIAKOVA (Ms.), Deputy Head, Department of Law, Ministry of Economy of Ukraine, State Enterprise "Ukrainian Intellectual Property Institute" (Ukrpatent), Kyiv

Dmytro KONDYK (Mr.), Leading Expert, Division of International Trademark Registration, Ministry of Economy of Ukraine, State Enterprise “Ukrainian Intellectual Property Institute” (Ukrpatent), Kyiv

Oksana PARKHETA (Ms.), Deputy Head, Department of the Information Support, Ministry of Economy of Ukraine, State Enterprise “Ukrainian Intellectual Property Institute” (Ukrpatent), Kyiv

II. ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES/ INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

ORGANISATION EURASIENNE DES BREVETS (OEAB)/EURASIAN PATENT ORGANIZATION (EAPO)

Saparbay EMINOV (Mr.), Director, Information Support and Publications Division, Patent Information and Automation Department, Moscow

Sergei LAPUSHKIN (Mr.), Deputy Director, Search and Retrieval Systems Section, Information Support and Publications Division, Patent Information and Automation Department, Moscow

Ikrom TAKHIROV (Mr.), Deputy Director, Formal Examination Division, Examination Department, Moscow

ORGANISATION EUROPÉENNE DES BREVETS (OEB)/EUROPEAN PATENT ORGANISATION (EPO)

Jose ALCONCHEL UNGRIA (Mr.), Director, Prior Art and Classification, Rijswijk
Roberto IASEVOLI (Mr.), Head, Classification Board, Prior Art and Classification, Rijswijk

Maarten ALINK (Mr.), Classification Board, Prior Art and Classification, Munich

Salvatore CHIARIZIA (Mr.), Program Manager, Rijswijk

Nelson DAS NEVES (Mr.), Project Coordinator, International Cooperation, Munich

Pierre HELD (Mr.), Administrator - Project Manager, Prior Art and Classification, Rijswijk

Alexander KLENNER-BAJAJA (Mr.), Head, Data Science, Rijswijk

Agnès MERLE GAMEZ (Ms.), Classification Board, Prior Art and Classification, Rijswijk

Jean-Marc JANYSZEK (Mr.), Director, Information Technology, Rijswijk

III. ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE/NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION

[ASSOCIATION EUROPÉENNE DES ÉTUDIANTS EN DROIT \(ELSA INTERNATIONAL\)/
EUROPEAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION \(ELSA INTERNATIONAL\)](#)

Clément LECROART (Mr.), Delegate, Brussels

Ilayda MEMIS (Ms.), Delegate, Brussels

Sara OLIVEIRA (Ms.), Delegate, Brussels

Klaudia PUDELKO (Ms.), Delegate, Brussels

IV. BUREAU/OFFICERS

présidente/Chair: Catia VALDMAN (Mme/Ms.) (Brésil/Brazil)

vice-présidents/
Vice Chairs: Magalie MATHON (Mme/Ms.) (France)
Yoshitaka OTA (M.Mr) (Japon/Japan)

secrétaire/Secretary: XU Ning (Mme/Ms.) (OMPI/WIPO)

V. BUREAU INTERNATIONAL DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)/ INTERNATIONAL BUREAU OF THE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)

Ken-Ichiro NATSUME (M./Mr.), sous-directeur général du Secteur de de l'infrastructure et des plateformes/Assistant Director General, Infrastructure and Platforms Sector

Kunihiko FUSHIMI (M./Mr.), directeur de la Division des classifications internationales et des normes, Secteur de de l'infrastructure et des plateformes/Director, International Classifications and Standards Division, Infrastructure and Platforms Sector

XU Ning (Mme/Ms.), chef de la Section de la classification internationale des brevets (CIB), Division des classifications internationales et des normes, Secteur de de l'infrastructure et des plateformes/Head, International Patent Classification (IPC) Section, International Classifications and Standards Division, Infrastructure and Platforms Sector

Rastislav MARČOK (M./Mr.), administrateur principal de la classification des brevets de la Section de la classification internationale des brevets (CIB), Division des classifications internationales et des normes, Secteur de de l'infrastructure et des plateformes/Senior Patent Classification Officer, International Patent Classification (IPC) Section, International Classifications and Standards Division, Infrastructure and Platforms Sector

Olivier COLLIOUD (M./Mr.), administrateur de projets de la Section des systèmes informatiques, Division des classifications internationales et des normes, Secteur de de l'infrastructure et des plateformes /Project Officer, IT Systems Section, International Classifications and Standards Division, Infrastructure and Platforms Sector

[Sigue el Anexo II]

ORDEN DEL DÍA

1. Apertura de la sesión
2. Aprobación del orden del día
3. Elección de la presidencia y de dos vicepresidencias
4. Informe sobre la marcha del programa de revisión de la CIP; formato de las futuras reuniones del Grupo de Trabajo sobre la Revisión de la CIP
Véanse los proyectos [CE 462](#) y [CE 539](#).
5. Informe sobre la marcha de los programas de revisión de la CPC y el FI
Informes de la OEP y la USPTO sobre la CPC, y de la JPO sobre el FI.
6. Informe del Grupo de Especialistas en Tecnologías de Semiconductores (EGST)
Véanse los proyectos [CE 539](#) y [CE 481](#).
7. Uso de marcas en la CIP
Véanse los proyectos [CE 539](#) y [M 815](#).
8. Enmiendas a la Guía de la CIP y otros documentos básicos de la CIP
Véanse los proyectos CE 454, CE 455 y CE 539.
9. Panorama general de la solución de gestión de listas de trabajo de la CIP (IPCWLMS) y cuestiones conexas
Véanse los proyectos CE 492 y CE 539.
10. Reclassificación de la CIP basada en la IA: posible sustitución de la “transferencia por defecto”
Véase el proyecto [CE 539](#).
11. Informe sobre los sistemas informáticos relacionados con la CIP
Ponencia a cargo de la Oficina Internacional.
12. Experiencias de las oficinas en la clasificación asistida por máquina (por ejemplo, basada en la IA)
Ponencias de las oficinas.
13. Marco de competencias técnicas para la clasificación de patentes
Véase el proyecto [CE 523](#).
14. Aprobación del informe
15. Clausura de la sesión

[Fin del Anexo II y del documento]